

## RPT-3000W での PS 薄膜測定のご紹介

(株)エー・アンド・デイ

販売促進部

## ■ はじめに

弊社 RPT-3000W を使ってどこまで薄い素材の測定、評価が可能か検討しておりました。この度、九州大学大学院工学研究院応用化学部門の田中研究室のご厚意によりシリコンウエハー上に作成された PS 薄膜サンプルをご提供いただき計測をいたしました。下記はその測定時の写真と結果データになります。

## ■ 測定治具

振子 FRB-100

エッジ RBP-040

上に錘 (3g スペーサ 4 個)

## ■ 測定試料

PS 薄膜 50, 100, 200 nm



Fig1. PS 試料の測定セット状態

## ■ 測定結果

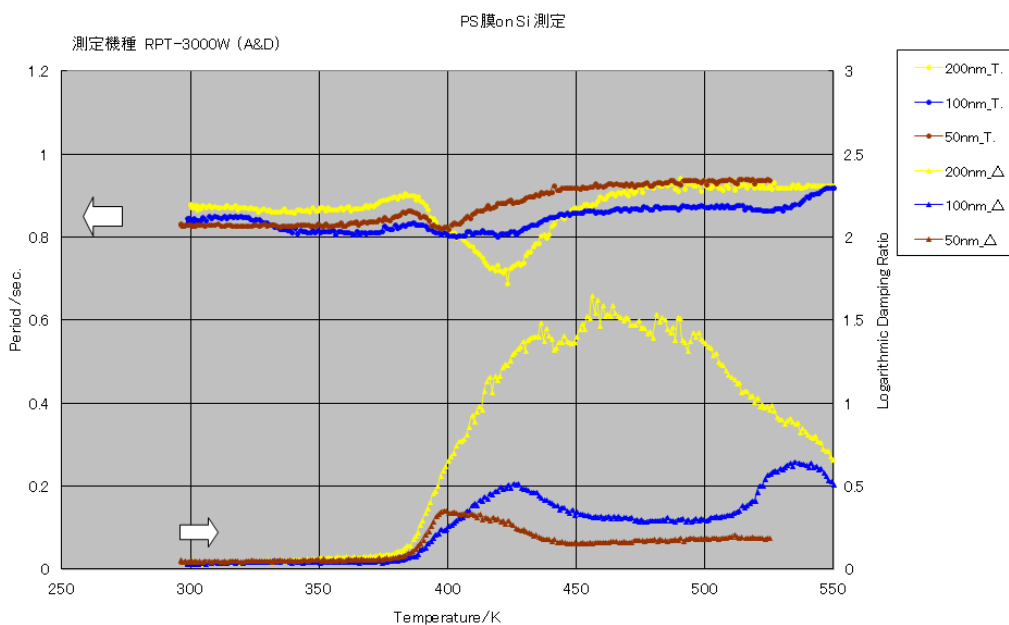


Fig.2 50, 100, 200nm の PS 薄膜の測定例

- 50, 100, 200 nm の厚さの試料でも計測可能。
- 更に超薄膜の領域においても十分計測できる可能性あり。

■ 謝辞

九州大学の田中敬二教授、犬束学先生より試料を提供いただき感謝申し上げます。

- 今回の計測結果、並びに剛体振子物性試験器の計測に関してご興味がありましたら、弊社の営業本部 販売促進部へお問い合わせください。

Tel 03-5391-6126 担当 須合(すごう)